PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-345025

(43)Date of publication of application: 03.12.2003

(51)Int.Cl.

GO3F 7/039 COSF 20/10 H01L 21/027

(21)Application number: 2003-134879 (22)Date of filing:

13.05.2003

(71)Applicant : EVERLIGHT USA INC (72)Inventor: CHEN CHI-SHENG

LI YEN-CHENG CHENG MENG-HSUM

(30)Priority

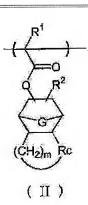
Priority date: 28.05.2002 Priority country: US Priority number: 2002 154826

(54) CHEMICALLY AMPLIFYING PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chemically amplifying photoresist composition.

SOLUTION: The chemically amplifying photoresist composition contains a polymer having a repeated structure of a unit expressed by formula (II), In formula (II), R1 represents H or 1-4C alkyl group, R2 represents a hydroxyl group, a 1-8C alkoxyl group or a 1-8C thioalkyl group, G represents (CH2)n, O or S, wherein n is an integer 0 to 4, Rc represents a lactone group and m is an integer 1 to 3. The chemically amplifying photoresist composition is used for general lithographic processes, in particular, for lithographic processes with a light source at 193 nm wavelength to have extremely preferable resolution, profile and photosensitivity.



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-345025 (P2003-345025A)

(43)公開日 平成15年12月3日(2003.12.3)

(51) Int.Cl.7		識別配号	FI		7	f-₹]-ト*(参考)
G03F	7/039	601	G03F	7/039	601	2H025
C08F	20/10		C08F	20/10		4 J 1 0 0
H01L	21/027		H01L	21/30	5 0 2 R	

審査請求 有 請求項の数23 OL (全 31 頁)

(21)出願番号	特膜2003-134879(P2003-134879)	(71)出顧人	503173021
			エパーライトユーエスエー インコーポレ
(22)出願日	平成15年5月13日(2003.5.13)		イティッド
			EVERLIGHT USA, INC.
(31)優先権主張番号	10/154, 826		アメリカ合衆国 ノースカロライナ州
(32)優先日	平成14年5月28日(2002.5.28)		26134 パインビル サザンループプーレ
(33)優先権主張国	米国 (US)		パード 10570
			10570 Southern Loop B
			lvd. Pineville, NC
			26134, USA
		(74)代理人	100082304
			弁理士 竹本 松司 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学増幅型ホトレジスト組成物

(57) 【要約】

【課題】 化学増幅型ホトレジスト組成物の提供。
【解決手段】 化学構画型ホトレジスト組成物の提供。
(11) が重複した構造のポリマーを含有する化学増幅
型ホトレジスト組成物であり、R¹ は日成いはC1ーC4のアルキル基。R² は水酸基、C1ーCsのアルコキシル基或いはC1ーC。のチオアルキル基。Gは(CH
2)。、O或いはS、そのうちnはO~4の整数、R cはラトン基。mは1~3の整数である。本学師の化学増幅型ホトレジスト組成物は一般のリソグラフィー工程、特に波長193nm光減のリソグラフィー工程、特に波長193nm光減のリソグラフィー工程に使用され、極めて良好な解析度、輪郭及び燃光度を有する。



(II)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の化学構造式1において(11)で 示されるユニットが重複した構造を具えたポリマーを具 え、

[化1]

そのうち、 R^1 はH或いは $C_1 - C_4$ のアルキル基、 R^2 は水機基、 $C_1 - C_5$ のアルコキシル基域いは $C_1 - C_5$ のチャアルキル基、G は (CH_2) 。、 O或いは S、 そのうちnは $D \sim 4$ の整数 R c は $D \sim 4$ かま $D \sim 4$ がま $D \sim 4$ かま $D \sim 4$ がま $D \sim 4$ か

トレジスト組成物。

【請求項2】 R¹ が水素或いはメチル基とされたこと を特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト 組成物。

2

【請求項3】 R² が水酸基、C₁ - C₄ のアルコキシル基、或いはチオアルキル基とされたことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項4】 mが1とされたことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

10 【請求項5】 Gが(CH2)。とされ、nが0、1或 いは2とされたことを特徴とする、請求項1記載の化学 増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項6】 Gが酸素或いはイオウとされたことを特 徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成

【請求項7】 ポリマーが以下の化学構造式2~化学構造式2~化学構造式8 において示される (II-1) ~ (II-7) の構造を有するものとされ、 【化2】

(II-1)

[(k3]

[化4]

【化5】

そのうち、g+h+i=1 であることを特徴とする、請 求項1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項8】 g/(g+h+i)=0.01から0.5、h/(g+h+i)=0.1から0.5、1/(g+h+i)=0.1から0.5、1/(g+h+i)=0.1から0.5であることを特徴とする、請求項7記蔵の化学特施型ホトレジスト組成物。 【請求項9】 ポリマーが以下の化学構造式9~化学構造式9~化学構造式9~化学構造式9~化学構造ない。

(II-8)

【化12】

【化13】

【化14】

そのうち、g+h+i=1 であることを特徴とする、請求項1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。 【請求項10】 g/(g+h+i)=0. 01から

【請求項 1 0】 g / (g+h+i) = 0.01から 学構造式 2 0において示される(1 1 0.5, h / (g+h+i) = 0.1から0.5, i / 20 − 19)の構造を有するものとされ、

する、請求項9記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。 【請求項11】 ポリマーが以下の化学構造式15~化 学構造式20において示される(II-14)~(II -19)の構造を有するものとされ、

(g+h+1) = 0. 1から0. 5であることを特徴と (代15) CH₃ CH₅ CH₅

【化16】

【化17】

【化18】

【化19】

[(£20]

そのうち、g+h+i+j=1であることを特徴とする、請求項 1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。 【請求項 12】 $g/\left(g+h+i+j\right)=0.01$ から0.5、 $h/\left(g+h+i+j\right)=0.1$ から0.5、 $i/\left(g+h+i+j\right)=0.1$ から0.5及び $j/\left(g+h+i+j\right)=0.1$ から0.5及び $j/\left(g+h+i+j\right)=0.1$ から0.5であることを

特徴とする、請求項11記載の化学増幅型ホトレジスト 組成物。

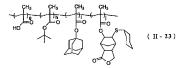
【請求項13】 ポリマーが以下の化学構造式21~化 学構造式24において示される(11-20)~(II -23)の構造を有するものとされ、

【化22】

9

【化23】

[(24]



 特徴とする、請求項13記載の化学増幅型ホトレジスト 組成物。

【請求項15】 ポリマーが以下の化学構造式25~化学構造式28において示される(11-24)~(11-27)の構造を有するものとされ、

[化25] **CH3**

[化26]

【化27】

【化28】

【化32】

【化33】

そのうち、g+h+i+j=1であることを特徴とする、請求項1 記蔵の化学増配要ホトレジスト報取物。 【請求項1 記蔵の化学増配要ホトレジスト報取物。 【請求項1 6】 g/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5かん f/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5及び f/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5であることを特徴とする、請求項1 5記載の化学増配型ホトレジスト組成物。

【請求項17】 ポリマーが有機溶剤に溶けるものとされ、且つガラス転移温度Tgが50から220℃の間とされ、分子量が1000から50000の間とされ、分評温度Tdが80でより高いことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項18】 請求項1記載の化学增縮型ホトレジスト組成物において、光機発生剤を更に含有し、該光機発 20 生剤は以下の化学構造式29から化学構造式52、即 ち、

[化29]

【化31】

【化30】

12

\$.032

【化36】

[(
$$\pm 3.7$$
] $C_8F_{17}SO_3$

で示されるもののいずれかとされたことを特徴とする、 化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項19】 請求項18記載の化学増幅型ホトレジスト組成物において、光酸発生剤の重量が各100部の 50 樹脂重量に対して、0.1から20部を添加することを 特徴とする、化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項20】 請求項1記載の化学増幅型ホトレジス ト組成物において、更に酸捕捉剤(Acid quen cher)を含有し、該酸補提剤が、水酸化テトラブチ ルアンモニウム(tetrabutylammoniu m hvdroxide)、テトラブチルアンモニウム ラクテート (tetrabutylammonium lactate)、トリプチルアミン(tributy lamine)、トリオクチルアミン(trioctv lamine)、トリエタノールアミン(trieth anolamine)、トリス〔2- (2-メトキシエ トキシ) エチル] アミン(tris[2-(2-met hoxyethoxy) ethyll amine), N (2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペリジン (N-(2. 3-dihvdroxvpropvl) pipe rijine)、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリ ジン (N- (2-hvdroxvethvl) pipe ridine)、モルホリン (morpholin)、 N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン (N-(2hydroxyethyl) morpholin). N 20 (2-ヒドロキシエチル)ピロリジン(N-(2-h) ydroxyethyl) pyrrolidine), 或いはN-(2-ヒドロキシエチル) ピペラジン(N-(2-hydroxyethyl) piperazin e) とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジス ト組成物。

【請求項21】 請求項20記載の化学増幅型ホトレジ スト組成物において、酸捕捉剤の添加量は光糠発生剤1 部につき、0.001から10部とされることを特徴と する、化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項22】 請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物を化学増幅型ホトレジストとして使用することを特徴とする、半導体装置製造のためのリソグラフィー方法。

【請求項23】 請求項22記載の半導体装置製造のた めのリソグラフィー方法において、露光工程を具え、該 露光工程中に波長が248nm或いは193nmの光源 を使用することを特徴とする、半導体装置製造のための リソグラフィー方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一種のホトレジスト 組成物に係り、特に、ポリマーを含有する化学幹幅型ホ トレジスト組成物、及び該ホトレジスト組成物が適用さ れるリングラフィー方法に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路の集積層の急速な増加により、 リソグラフィー技術の要求する線順もますます小さくなっている。理論上、リソグラフィー工程で得られるバタ 一ン解析度を良好とするために知波長の光線を使用する 16 か、或いは孔径数値の大きい光学システムを使用する。

「0003」近年、193 mm波艮の光頭で入るとのである。 高分子が発表され、それは四種類の高分子モノマーの共 重合により形成された高分子共重合物であり、1BMA 一MMA - はBMA 一MMA (表リイソボルニルメタクリ リレートーメタクリリックアシド;poly isobo rnyl methacrylate—methyl methacrylate—t-butyl meth acrylate—methacrylicacd)と 称され、その構造は以下の化学構造式53の如しであ

【0004】上述のポリマーは尚も欠点がある。まず、四種額の高分子モノマーが共産合してなるポリマーは抵エッチング能力が非常に弱く、且つ能差の性質も不良である。これにより、このポリマーをホトレジスト組成がに応用するならば、特別に新たな製造工程を開発する必要がある。このほか、特許文献1~31多種類の異なるホトレジスト組成が記載され、並びに半導体集積回路装置の年度に近用されている。

[0005]

【特許文献1】米国特許第6,271,412号 【特許文献2】米国特許第6,280,898号

[特許文献3] 特開2001-242627

[0006]

[00009]

【発明が解決しようとする課題】 本発明に記載の新規な ホトレジスト組成は良好な親水性、付着性、及び抗ドラ イエッチング等の優れた性能を具備し、これらの優れた 性能によりホトレジスト組成と基板の転割性が増加し、 ホトレジストの成勝性が増加し、現像後のホトレジスト パターンが相倒しにくくなる。このほか、親水性の増加 により、現像液が均一にホトレジスト表面に分布し、ホ トレジストバターン表面の角一件を密める。

【0007】本発明の主要な目的は、化学物館団ホトレジスト組成物を提供することにあり、この化学物館型ホトレジスト組成物はリングラフィー工程に応用され、良好な解析度、輸売及び感光度を具備するものとされる。 【0008】本発明の別の目的は、一種の半導体装置のリソグラフィー製造方法を提供することにあり、それは特に「93mm光源に適用されるリソグラフィー製造方法を提供することにあり、それはするにあり、権めて良好な解析度、輸売及び感光度を達成する方法とされる。 【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、以下 の化学構造式54において(II)で示されるユニット が重複した構造を具えたポリマーを具え、

【化54】

そのうち、R¹ はH或いはC₁ - C₄ のアルキル基、R
² は水機基、C₁ - C₅ のアルコキシル基域いはC₁ C₅ のチオアルキル基、Gは(C H₂)。、O或いは
S、そのうちnはO~4の整数、R cはラクトン基、m
は1~3の整数であることを特徴とする、化学物観即ホ

トレジスト組成物としている。請求項2の発明は、R1 が水素或いはメチル基とされたことを特徴とする、請求 項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。 請求項3の発明は、 R^2 が水酸基、 $C_1 - C_4$ のアルコ キシル基、或いはチオアルキル基とされたことを特徴と する、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物と している。請求項4の発明は、mが1とされたことを特 徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成 物としている。請求項5の発明は、Gが(CH2) 』と 10 され、nが0、1或いは2とされたことを特徴とする、 請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としてい る。請求項6の発明は、Gが酸素或いはイオウとされた ことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジ スト組成物としている。請求項7の発明は、ポリマーが 以下の化学構造式55~化学構造式61において示され る (11-1) ~ (11-7) の構造を有するものとさ れ 【化55]

(II-1)

【化56】

【化57】

[(k.58]

そのうち、g+h+i=1であることを特徴とする、請 10 求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としてい る。請求項8の発明は、g/(g+h+i)=0. 01 b50.5, h/(g+h+i) = 0.1b50.5,i/(g+h+i)=0.1から0.5であることを特 徴とする、請求項7記載の化学増幅型ホトレジスト組成 物としている。請求項9の発明は、ポリマーが以下の化 学構造式62~化学構造式67において示される(II -8)~(II-13)の構造を有するものとされ、 【化62】

【化65】

【化66】

[化67]

そのうち、g+h+i=1であることを特徴とする、 隷 次項 1 記機の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。 請 決項 1 0 の発明は、g / (g+h+i)=0. 0 1 から 0. 5、h / (g+h+i)=0. 1 から 0. 5 5、i / (g+h+i)=0. 1 から 0. 5 であること を特徴とする、請求項 9 記題の化学増幅型メトレジスト

21

組成物としている。請求項11の発明は、ポリマーが以下の化学構造式68~化学構造式73において示される (11-14)~(11-19)の構造を有するものと され、 【化68】

[化69]

[化70] 50

【化71】

[化72]

【化73】

であることを特徴とする、請求項 11 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求項 13 の発明は、ポリマーが以下の化学構造式 74 ~化学構造式 77 において示される(11-20)~(11-23)の構造を有するものとされ。

【化74】

【化75】

【化76】

【化77]

そのうち、g+h+i+j=lであることを特徴とする、請求項 1 記載の化学指標型ホトレジスト組成物としている。請求項 1 4 の発明は、g / (g+h+i+j) = 0.01かち0.5、h/(g+h+i+j)=0.1かち0.5、i/(g+h+i+j)=0.1から0.5及び |/(g+h+i+j)=0.1から0.5及び |/(g+h+i+j)=0.50505

5 30 【化78】 **CH3**

【化79】

【化80】

【化81】

そのうち、g+h+i+j=1であることを特徴とす る、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物とし ている。請求項16の発明は、g/(g+h+i+j) =0.01 b 50.5, h/(g+h+i+j)=0. 1 \$b\$ 60. 5, i / (g+h+i+j) = 0. 1 \$b\$ 50.5及びj/(g+h+i+j)=0.1から0.5であることを特徴とする、請求項15記載の化学増幅型 ホトレジスト組成物としている。請求項17の発明は、 ポリマーが有機溶剤に溶けるものとされ、且つガラス転 移温度Tgが50から220℃の間とされ、分子量が1 000から5000000間とされ、分解温度Tdが8 0℃より高いことを特徴とする、請求項1記載の化学増 幅型ホトレジスト組成物としている。請求項18の発明 は、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物にお いて、光酸発生剤を更に含有し、該光酸発生剤は以下の 30 化学構造式82から化学構造式105、即ち、

[化82]

[化83]

[化84]

28

【化85】

【化86】

【化87】

[(£8 8]

【化89】

【化97】

【化98】

 $(\text{H}: 1 \ 0 \ 4) \\ \text{H}_3\text{C} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & N_2 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & C & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow C\text{H}$ $(\text{H}: 1 \ 0 \ 5) \\ \text{F}_3\text{C} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & N_2 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & C & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow C\text{F}_3$

で示されるもののいずれかとされたことを特徴とする、 化学学輸配型ホトレジスト組成物としている。請求項19 の発明は、請求項18記載の化学增極型ホトレジスト組 成物において、光酸発生剤の重量が名100部の樹脂重 量に対して、0.1から20部を添加することを特徴と する、化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求 項20の発明は、請求項1記載の化学増幅型ホトレジス ト組成物において、更に酸捕捉剤(Acid quen cher)を含有し、該酸捕捉剤が、水酸化テトラブチ ルアンモニウム (tetrabutylammoniu m hvdroxide)、テトラブチルアンモニウム ラクテート(tetrabutylammonium lactate)、トリプチルアミン(tributy lamine)、トリオクチルアミン(triocty lamine)、トリエタノールアミン(trieth 10 anolamine)、トリス「2-(2-メトキシエ トキシ) エチル] アミン(tris[2-(2-met hoxyethoxy) ethyll amine), N (2、3ージヒドロキシプロピル)ピペリジン(N-(2, 3-dihydroxypropy1) pipe rijine)、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリ ジン (N- (2-hydroxyethy1) pipe ridine)、モルホリン (morpholin)、 N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン (N-(2hydroxyethyl) morpholin). N 20 (2-ヒドロキシエチル)ピロリジン(N-(2-h) ydroxyethyl) pyrrolidine), 或いはN-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン(N-(2-hydroxyethyl) piperazin e) とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジス ト組成物としている。請求項21の発明は、請求項20 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物において、酸捕捉 剤の添加量は光酸発生剤1部につき、0.001から1 ①部とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジス ト組成物としている。請求項22の発明は、請求項1記 30 載の化学増幅型ホトレジスト組成物を化学増幅型ホトレ ジストとして使用することを特徴とする、半導体装置製 造のためのリソグラフィー方法としている。請求項23 の発明は、 請求項22記載の半導体装置製造のためのリ ソグラフィー方法において、露光工程を具え、該露光工 程中に波長が248nm或いは193nmの光源を使用 することを特徴とする、半導体装置製造のためのリソグ ラフィー方法としている。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の化学増幅型ホトレジスト 40 組成物は、化学構造式106で示されるユニットが重複する構造を見えたポリマーとされる。

[(k106]



そのうち、R¹ はH或いはC₁ - C₄ のアルキル基、R ² は水酸基、C₁ - C₅ のアルコキシル基或いはC₁ -C₅ のチオアルキル基、Gは(C H₂)。、O或いは S、そのうちnはO~4の整数、R c はラクトン基、m は1~3の数数である。

【0011】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は、上記化学構造式106で示されるユニットが重複した構造を有するポリマーであり、実際の必要に応じてその他の成分、即ち、光酸発生剤(Photo-acidgenerator: PG)、酸構能剤(Acid - quencher)、添加剤(addltive)及び

溶剤(solvent)等の成分を含有しうる。

【0012】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は リソグラフィー工程、特に193nmのリングラフィー 工程に応用可能で、極めて良好な解析度、輸卵及び感光 度を有する。リソグラフィー工程は周知の技術であるた め、説明を常略する。

【0013】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 半導体装置のリングラフィー製造方法、特にリングラフィー製造方法の193 nm分光弧を使用した露光工程に 応用されうる。本発明のリングラフィー製造方法は、極 めて食好な解析像 輪郭及び張光瓊を有する。

【0014】本発明の組成物中、上記化学構造式106 のユニット(II) が重複する構造のポリマーは、以下 の化学構造式107で示される化合物(I) より生成さ れる。

[(E107]

(I)

【0015】そのうち、R! はH或いはC₁ - C₄ のア
so ルキル基、R² は水酸基、C₁ - C₈ のアルコキシル基

或いはC₁ ーC₈ のチオアルキル基、Gは(C H₂) 。、O或いはS、そのうちnはO〜4の整数、R c はラ クトン基。mは1〜3の整数である。この任合物に触媒 の存在下で自己重合反応させるか、或いはその他のビニ ルモノマーと共重合反応させる。

【0016】化合物(1)は、以下の化学構造式108 に示される方法(工程1から工程5)により合成される が、この方法に限定されるわけではない。

【化108】

そのうち、 R^1 、 R^2 及びGの定義は前述したとおりである。

工程 5

【0017】 工程1では、適当なジエン化合物、例えば ブタジエン(butadiene)、シクロペンタジエ 20 (cyclopentadiene)、ララン(fu ran)とチオフェン(thiophene)を、無水 マレイン酸(maleicanhydride)とディ ールスーアルゲー反応させる。

【0018】 工程2では、工程1で得られた製品を、還元剤(例えばLiAlHa或いはNaBHa)で無水極性溶剤中で還元反応させ、酸無水物を還元してラクトンとなす。

【0019】 工程3では、工程2で得られた製品に対して過酸化物(peroxide)で二重結合を酸化して 40 エポキシド(epoxide)となす。

【0020】 工程4では、工程3で得られた製品を酸性 条件下で適当な求核試薬 (例えば水、アルコール、チオ ール) で開環付加反応させてヒドロキシル基を具えた誘 導体を得る。

【0021】工程5では、工程4で得られた製品をさら に塩化(アルキル)アクリロイル((alkyl) ac ryloyl chloride)或いは塩化アクリロ イル(acryloyl chloride)でエステ ル化し、こうして化合物(1)を得る。 【0022】本発明の前述の化学構造式106に示されるコニット(11)のホトセンシティブボリマーは化合物(1)をその他の異なるビニルモノマーと触媒存在下で共重合反応式せることにより形成される。

34

【0023】前述のビニルモノマーの選択には特別な制 限はない。しかし、このポリマーに193 nmの光を通 す特性を具備させるため、芳香族構造を含まないビニル モノマーを選択し、これによりポリマーに193 nmの 光線を透過させる特性を付与する。そのうち、ビニルモ 10 /マーの例は以下の化学構造式109から化学構造式1 31に示されるようであり、そのうち、R¹ は日或いは C₁ ~ C4 のアルキル基とされる。

【化109】

$$=$$
 $\stackrel{R^3}{=}$ 0

【化110】

【化111]

【化112】

【化113】

【张114】

【化116】

【化117]

【化118】

【化119】

【化120】

(19)

【化121】

【化122】

【化123】 【化124】

【化125】

【化126】

【化127】

37

【化128】

\rightarrow

【化129】

Ho

【化130】

【化131】



【0024】化合物(I)により自己重合或いは共重合 反応によりユニット(II)が重複する構造のポリマー が形成される。

[化132]

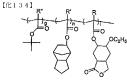
(CH₂)_m Re

そのうち、 R^1 、 R^2 及びG 、R c 及びmの定義は前述したとおりである。

【0025】化合物(1)が、自身或いは一種類或いは 数種類の他のピニルモノマーと重合してポリマーが形成 され、好ましくは、このポリマーは、以下の化学構造式 133中に示されるポリマー(110)、化学構造式 134 中に示されるポリマー(1V)或い社化学構造式 135 中に示されるポリマー(V)とされる。

【化133】

. F/k194



(IV)

【化135】

そのうち、R、R'、R'はそれぞれ水素或いはメデル 10 結とされ、且つg+h+i=1或いはg+h+i+j=1とされる。好法しくは、そのうちg/(g+h+i)=0.01かち0.5、h/(g+h+i)=0.1かち0.5、i/(g+h+i)=0.1かち0.5、i/(g+h+i)=0.1かち0.5、i/(g+h+i)=0.1かち0.5、i/(g+h+i+j)=0.1か50.5、i/(g+h+i+j)=0.1か50.5、i/(g+h+i+j)=0.1か50.5及i/(g+h+i+j)=0.1か50.5及i/(g+h+i+j)=0.1か50.5を含すi/(g+h+i+j)=0.1か50.5をされる。

【0026】上述のポリマーは単独で、或いは二種類が、或いは二種類以上が混合されて使用される。

【0027】本発明の使用するポリマーは、好ましくは 有機溶剤に溶け、且つガラス転移温度 Tgが50から2 20℃とされ、分子量は、1000か5000000とさ れ、分解温度す dが80でより大きい。

【0028】本弾明の使用するボリマーの合成方法に、 特殊な制限はないが、好ましくは、上述のモノマーを使 用し触媒下で重合反応させる。触媒は周知の触媒が使用 されるが、好ましい触媒は、2,2'ーアゾーピスーイ ソブチロニトライル(2,2'ーazo-bis-is obutyronitrile:AlBN)或いはジメ チルー2,2'ーアゾーピスーイソブチレートラジカル イニシエーター(dimethyl-2,2'ーazobis-isobutyrate radical initiator;V-601)とされる。

【0029】 本発明の化学前機型ホトレジスト組成物 は、ユニット(II) が重複する構造のボリマーと、大 歳発生剤(Photo—acid generato r; PAG)、機能提別(Acid quenche r)、添加別(additive)、及び溶剤(sol vent)のようなその他の成分で組成される。

【0030】本発明の使用する光機発生剤に特別な制限 はないが、紫外線或いはその他の輻射線照射により酸を 発生できるものとされ、その他の輻射線照射により酸を 発生できるものとされ、その他の基本要求は、露光前に 一定程度の安定性を有して工程の信頼性への影響を防止 できることである。好ましい光機発生剤は、以下の化学 構造式136から化学構造式158に示されるものであ る。

【化136】

40

[{£1 3 7]

【0031】上述の光酸発生剤は、単独で、或いは二種類が、或いは二種類が、或いは二種類以上が混合されて使用される。10 0部の機断重量下で、光酸発生剤の添加量は0.1か5 20部とされ、また好ましい添加量は0.5から7部とされる(この部分の全ての比の値は重量計算による)。

【0032】本発明の酸捕捉剤は、ホトレジスト中の光 酸発生剤の発生する酸性イオンの拡散特性を調整し、ホ トレジストの特性を良好とするために用いられる。本発 明に適用される好ましい酸補提剤は、水酸化テトラブチ ルアンモニウム (tetrabutylammoniu m hydroxide)、テトラブチルアンモニウム ラクテート (tetrabutylammonium lactate)、トリプチルアミン(tributy lamine)、トリオクチルアミン(triocty lamine)、トリエタノールアミン(trieth anolamine)、トリス〔2-(2-メトキシエ トキシ) エチル] アミン(tris[2-(2-met hoxyethoxy) ethyll amine), N (2, 3ージヒドロキシプロピル) ピペリジン (N-(2, 3-dihydroxypropy1) pipe rijine)、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリ ジン (N- (2-hvdroxvethv1) pipe ridine)、モルホリン (morpholin)、 N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン (N-(2hvdroxvethvl) morpholin). N 20 (2-ヒドロキシエチル)ピロリジン(N-(2-h) ydroxyethyl) pyrrolidine), 或いは N - (2 - ヒドロキシエチル) ピペラジン (N -(2-hydroxyethyl) piperazin e) とされる。酸捕捉剤の添加量は光酸発生剤の0.0 01から10部とされ、好ましい添加量は各部光酸発生 剤の0.01から1部(ここで全ての比率は重量計算に よる)。

【0033】本発明の添加剤に特殊な制限はなく、増感 剤(sensitizers)、溶解抑制剤(diss olution inhibitors)、界面活性剤 (surfactants)、安定剤(stabili zers)、染料(dyes)とその他の樹脂が任意に 添加され、ホトレジストに必明な再まな確ませる。

【0034】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物を 製造するのに用いられる溶剤に特殊な制限はなく。例え ば高級アルコール (例えばn-オクタノール)、グリコ 一ル酸及びその誘導体(例えばメチルラクテート、エチ ルラクテート及びエチルグリコレート)、グリコール酸 エーテル及びその誘導体(例えばグリコール酸エチルア セテート、グリコール酸メチルアセテート、グリセロー ルメチルアセテート)、ケトエステル(例えばメチルア セトアセテート、エチルアセトアセテート)、アルコキ シカルポキシレート (例えばエチル2-エトキシアセテ ート、メチル3ーメトキシプロピオネート、エチル3ー エトキシプロピオネート、或いはメチルエトキシプロピ オネート)、ケトン(例えばメチルエチルケトン、メチ ルペンチルケトン、アセチルアセトンシクロペントン、 シクロヘキソン、或いは2-ヘパトン)、ケトエーテル (例えばジアセトアルコールメチルエーテル)、ケトア ルコール (例えばアセトアルコール或いはジアセト
ン)、アルコールエーテル (例えばグリコール権プチル
エーテル或いはプロピレングリコールエチルエーテ
ル)、アミド (例えばグメチルアセトアミド或いはジメ
チルホルムアミド)、エーテル (例えばフェニルエーテ
ル或いはトリエチレングリコールジメチルエーテル)、
或いはそれらの融合物とされる。好ましくは、化学増幅
型ホトレジスト組成物の好ましい溶剤は、nーオクチル
アルコール、プロピレングリコールメチルエーテルアセ
テート、エチル3ーエトキシプロピオネート、エチル2
ート、メチルエトキシブロピオネート、メチルエトナルケ
トン、メチルベンチルメチルケトン、メチルベンチルメチルケトン、メチルでスースート、デリコール
をアチルエーテルアロピルクリコールエチルエーテル
をアチルアセーテート、グリコール

44

【0035】溶剤は通常、樹脂100部に対して200 -2000部、好ましくは400-1000部添加され る(重量比)。

或いはそれらの混合物とされる。

【0036】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 上述の成分を混合して得られる。まず、上述のボリマー を溶剤中に溶かし、さらにその他の成分を握入させる。 或いは先にボリマー以外の成分を溶剤中に溶かし、その 後にボリマーを握入させる。

【0037】化学増加型ホトレジスト組成物の含有する 不純物 (例えば微量の金属及びハロゲン) の量をできる だけ減らすため、各成分を混合して化学増相型ホトレジ スト組成物を得る前に、先に純化して純度を改善する。 或いは各成分を先に混合して化学増加型ホトレジスト組 成物を得る、その後化使用前に純化する。

【0038】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は、リソグラフィー工程に応用され、伝統的な波長のリソグラフィー工程のほか、193 nm光線を使用したリソグラフィー工程に応用されうる。

【0039】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 周知の方法を利用してパターンを形成できる。先に化学 増幅型ホトレジスト組成物を基板の上に塗布し、続い て、露光、現像等の工程を行う。

【0040】基板はウエハー或いは多種類の材料とさ れ、コーティングはスピンコーティング、双プレーコー ティング、或いはローラコーティング等の方法で実施さ れる。基板にコーティングした後、通常は加熱板の上に 置いて加熱し、溶剤を除去し、続いてマスクを利用し露 光し、基板 ドロを夢なパケーンを形成する。

【0041】現像液は、アルカリ溶液、例えばアンモニ ア水、トリエチルアミン、ジメチルアミノメタノール、 水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化ナトリウム、 水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸 化トリメチルヒドロキシルエチルアンモニウムの水溶液 とされうる。

容を説明する。

(1-1) の合成

【0042】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 極めて良好な解析度、輪郭及び感光度を具え、且つフォ ーカス深度、露光境界と境界除去において優れた表現を 有する。

[0043]

16.6グラムの8,9-エポキシ-3-オキソー4-オキサートリシクロ〔5、2、1、0^{2,6} 〕 デカン (8. 9-epoxy-3-oxo-4-oxa-tr i c v c l o [5. 2. 1. 0^{2,6}] de c a n e) を 200mLのメタノールに溶かし、並びに濃硫酸0.2 5 m L を加え開環反応させる。反応完成後の溶液は中和 されており、それを減圧濃縮後に、残留物に200mL の塩化メチレンと10.2gのトリエチルアミンを加え て溶かす。この混合物に15℃で、10.5gの塩化メ タクリロイルを流状で加える。添加後に溶液を室温で4 時間撒拌し、伝統的な抽出と洗浄を行う。収集された油 状の物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離 し、淡黄色の油状液体製品である9-メトキシ-5-オ キソー4-オキサートリシクロ〔5, 2, 1, 02,6 〕 デクー8-v1-メタクリレート(9-methoxy -5-oxo-4-oxa-tricyclo [5. 2. 1. 02.6] dec-8-y1-methacry

I a t e) (I-1) 18. 9g (収率: 75%) を得る。スペクトル鑑定した結果は以下のようである。 H-NMR (CDC1s, 30 0 MH z) δ5. 89 (1H, brs)、5. 37 (1H, brs)、4. 8 1 (1H, m)、3. 96 (1H, m)、3. 67-3. 57 (2H, m)、3. 54 (3H, s)、2. 7 9 (1H, m)、2. 57 (1H, m)、2. 55 (1H, m)、2. 37 (1H, m)、1. 77-1. 74 (4H, m)、1. 38 (1H, m)

46

【実施例】以下に具体的実施例を挙げて本発明の技術内

【0044】準備例1:モノマーの合成

(I-1)

o ³ C-NMR (CDC ls, 75MHz) δ171. 4、165.6、136.0、124.8、84.9、 79.5、70.0、51.0、46.1、45.7、 40.4、39.1、32.4、17.8。 【0045】準備例2:モノマーの合成 【1-2)の合成 【化160】

16.6グラ人の8.9-エポキシー3-オキソー4-オキサートリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,6}] デカン (8, 9-epoxy-3-oxo-4-oxa-tr i c v c l o [5. 2. 1. 0^{2,6}] de cane) & 200mLのメタノールに溶かし、並びに濃硫酸0.2 5 m L を加え開環反応させる。反応完成後の溶液は中和 されており、それを減圧濃縮後に、残留物に200mL の塩化メチレンと10.2gのトリエチルアミンを加え て溶かす。この混合物に15℃で、10.5gの塩化ア クリロイルを滴状で加える。添加後に溶液を室温で4時 間攪拌し、伝統的な抽出と洗浄を行う。収集された油状 の物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離 し、淡黄色の油状液体製品である9-メトキシ-5-オ キソー4-オキサートリシクロ〔5.2.1.0^{2,6}〕 デクー8-y1-アクリレート(9-methoxy-5-oxo-4-oxa-tricyclo [5. 2. 1. 0^{2,6}] dec-8-v1-acrv1ate)

40.8, 39.6, 32.9.

(I-2) 18.9g(収率:75%)を得る。スペク

【化161】

47

【0046】準備例3:モノマーの合成(I-3)の合成

H* (BELT 7 9 DELT A)

C2H6OH CH5Cls / BlyN C.H.C)

準備例 2の工程を重複して行うが、8、9 - エポキシー 3 - オキソー 4 - オキサートリシクロ〔5 . 2 . 1 . 0 . 6 . 〕 デカンの代わりに、3、4 - エポキシー 7 - オキ ソー8 - オキサーバイシクロ〔4 . 3 . 0 〕 / ナン 〔3、4 - e p o x y - 7 - o x o - 8 - o x a - b i c y c l o 〔4 . 3 . 0 〕 n o n a n e) を使用し、メタノールの代わりに無水エタノールを使用して反応させる。無色の油状液体製品である 4 - エトキシー 9 - オキ ソー8 - オキサーバイシクロ〔4 . 3 . 0 〕 ノン - 3 · y 1 アクリレート〔4 - e t h o x y - 9 - o x o - 8 - o x a - b i c y c l o [4 . 3 . 0] n o n - 3 - y 1 a c r y 1 a t e) 〔1 - 3 〕 が得られる。 1 H - N M R(C D C l s . 3 0 0 M H z . J i n H z) る 6 . 2 8 〔1 H . d d , J = 17 . 4 , 1 .

6), 5. 75 (1H, dd, J=10. 6, 1. 8), 4. 91 (1H, brs), 4. 11 (1H, m), 3. 85 (1H, m), 3. 58 (1H, m), 3. 44 (1H, m), 3. 22 (1H, m), 2. 6 1-2. 47 (2H, m), 2. 25 (1H, m)

(1-3)

48

1. 91-1. 72 (2H, m), 1. 09-0. 97 (5H, m)_o
³ C-NMR (CDC1₃, 75MHz) δ171. 6, 164. 7, 130. 9, 128. 0, 71. 2, 70. 8, 69. 2, 63. 8, 35. 7, 30. 3,

25. 1、20. 7、14. 9。 20 【0047】準備例4~7:準備例1の工程を重複して 行ない、異なる初反応物と溶剤で反応を行わせ、その結 果を表」に示した。

【0048】準備例8: ポリマー(11-1)の合成 ルメタクリレート、4.69gの2-メチル-2-アダ 20mLのテトラヒドロフラン、2.13gの第3プチ 50 マンチルメタクリレート及び3.99gの9-メトキシ

-5-オキソー4-オキサートリシクロ〔5、2、1、 0^{2.6} 〕 デク-8-y1-メタクリレートを反応器中で 混合し、イニシエーターの2、2'-アゾービス-イソ ブチロニトライル (AIBN) を1.1g加えて70℃ で一晩反応させ、それから20mLのテトラヒドロフラ ンを加える。次に、溶液を1Lのヘキサンを容れた容器

【0049】準備例9:ポリマー(II-2)の合成 20mLのテトラヒドロフラン、2、13gの第3プチ ルメタクリレート、4.69gの2-メチル-2-アダ マンチルメタクリレート及び4、02gの4-エトキシ -9-オキソー8-オキサーバイシクロ〔4.3.0〕 ノン-3-v1-メタクリレートを反応器中で混合し、 イニシエーターの2, 2'-アゾービス-イソプチロニ 20 移温度Tg=121℃であった。 トライル (AIBN) を1.1g加えて70℃で一晩反

【0050】準備例10~34:ポリマー(11-3) から(11-27)の合成

準備例8の方法を用いるが、異なるモノマーを使用して 重合反応させ、白色粉末(以下の化学構造式164から

【化165】

に加え、白色固体沈殿を生成させ、ろ過と乾燥の後、白 色粉末8. 43gを得る(化学構造式162中の式11 1で示されるポリマー)。収率は78%であり、GP C測定したところ、重量平均分子量は14100で、ガ ラス転移温度Tg=169℃であった。

50

【化162】

応させ、それから20mLのテトラヒドロフランを加え る。次に、溶液を11のヘキサンを容れた容器に加え、 白色固体沈殿を生成させ、ろ過と乾燥の後、白色粉末 6. 83g(化学構造式163中の式II-2で示され るポリマー)を得る。収率は63%であり、GPC測定 したところ、重量平均分子量は19200で、ガラス転

【化163】

化学構造式188中の式11-3から11-27で示さ 30 れるポリマーを得る。

[化164]

[g=0.30, h=0.40, i=0.30,

【化166】

(II -5)
[g=0.30, h=0.40, i=0.30,

52

【化167】

(II -6)
[g=0.30, h=0.40, i=0.30,
M_w=15400]

[化168]

(II -7)
[g=0.30, h=0.40, i=0.30,
Mw=14600]

【化169】

(II -8)
[g=0.50, h=0.10, i=0.40,
M_w=10200]

【化170】

(II -9)
[g=0.50, h=0.10, i=0.40,
M_w=9700]

【化171】

(II -10)
[g=0.50, h=0.10, i=0.40,
M_w=11600]

【化172】

(Π -11) [g=0.50, h=0.10, i=0.40,

ı

【化173】

(II-12)
[g=0.50, h=0.10, i=0.40,
Mw=9300]

[(E174]

(H-13) [g=0.50, h=0.10, i=0.40,

【化175】

(II -14)
[g=0.05, h=0.30, i=0.40,

【化176】

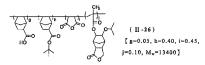
40

【化177】

【化178】

50

【化187】



[(k188]

【0051】実施例1:化学増幅型ホトレジスト組成物の製造

準備例8で得た式(IIー1)で示されるポリマー2 40 g、トリフェニルスルホニウムパーフルオロー ーブタ y スルホネート (triphenylsulfonium perfluoroーI ー butanes ulfonate: TPSーPFBS) 0.05 g及び第3ブチルコレート (tertーbutyl cholate: TBC) 0.06 g、プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート (PGMEA) 10.4 g及びNー(ヒドロキシメチル) ピペリジン (Nー(hydrox ymethyl) piperidine) 0.5 mgを 均一に混合し、その後、0.45 μmのの過騰でこの路 50

液を
る過した後、この溶液をドライシリコン片の上に塗布し、さらに2800 rpmで30秒スピンコーティン
の グし、均一な海豚を得る。その後、この薄豚を130℃
で90秒間乾燥させ、306.7 nm厚さの豚を得る。さらに193 nmで照射エネルギー量10-30mj/
cm²の蒸砕外線(DU) をこの薄駄に照射し、その後、130でサーモブレート上で90秒間加熱する。さらに、2.38%の水酸化デトラメチルアンモニウム
(1etramethyl ammonium hyd
roxide:TMAH) 水溶液で、この照射後の薄膜を現像し、腹イオン水で洗浄後、回転乾燥させ、電子頻 微酸でこのホトレジストの構造を注意したところ、0.
15 μmの解析度を有する構造が示された。0.

【0052】実施例2~16:ホトレジスト組成物の製

60 及び31で得られたポリマーを実施例1のポリマーの代 わりに使用した結果を以下の表2に示した。

実施例1の工程を重複し、準備例9~15、21~27 【表2】

		ポリマー	薄膜厚さ (nm)	解析度 (µm)
実施例	2	(II - 2)	317.8_	0.18
実施例	3	(II - 3)	326.0	0.18
実施例	4	(II - 4)	298.5	0.15
実施例	5	(II - 5)	278.8	0.15
実施例	6	(II - 6)	321.0	0.15
実施例	7	(II-7)	306.8	0.18
実施例	8	(II - 8)	304.5	0.15
実施例	9	(II - 14)	320.7	0.20
実施例	10	(II - 15)	334.9	0.20
実施例	11	(II - 16)	310.2	0.15
実施例	12	(II - 17)	296.6	0.15
実施例	13	(II - 18)	275.8	0.15
実施例	14	(II - 19)	330.5	0.18
実施例	15	(II - 20)	309.7	0.15
実施例	16	(II - 24)	318.5	0.20

[0053]

【発明の効果】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物 は、リソグラフィー工程、特に193nmのリソグラフ ィー工程に応用され、並びに極めて良好な解析度、輪郭 30 定するものではなく、上述の実施例に基づきなしうる細 及び感光度を有する。

【0054】総合すると、本発明はその目的、手段、機

能のいずれにおいても、周知の技術の特徴とは異なって いる。但し注意すべきは、上述の多くの実施例は説明の ために提示されたものであって、本発明の権利範囲を限 部の修飾或いは改変は、いずれも本発明の請求節囲に属 するものとする。

フロントページの続き

(72) 発明者 陳 啓盛

台湾台北縣三重市安慶街312號之1

(72)発明者 李 晏成

台湾台北縣三重市力行路一段123巷9號之

3 (72)発明者 鄭 孟勲

台湾桃園縣中▲り-▼市富強街16巷15號

F ターム(参考) 2HO25 AAO1 AAO2 AAO3 AB16 ACO4

ACO8 ADO3 BEO0 BEO7 BE10 BG00 CB13 CB14 CB41 CB55 CB56 CB60 CC20 FA17

4J100 AJ020 AJ02S AK32S AL03P ALOSO ALOSE BAOSE BAOSE

> BAO5R BAO6R BA11R BA53R BCO4R BCO9Q BC53R CA05

CA06 TA38